

## 是德科技承诺积极支持美国白宫先进无线通信研究平台(PAWR)计划

是德科技将贡献包括灵活的硬件和软件产品,以及提供专业的技术支持

2016年8月3日,是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,将积极支持先进无线通信研究平台(PAWR)计划([www.us-ignite.org/wireless](http://www.us-ignite.org/wireless))。该计划是一个由美国发起的行业联盟,主要目标是创建4个城市级的测试平台。是德科技还确认将加入PAWR理事会。美国白宫已于7月15日发布了此消息。PAWR是由美国科学基金会(NSF)领导的先进无线通信研究计划([www.nsf.gov/cise/advancedwireless](http://www.nsf.gov/cise/advancedwireless))的一个组成部分。

是德科技总裁兼首席执行官 Ron Nersesian 表示:“在迈向2020年的竞赛中,我们的员工和产品已做好充分准备,将会帮助联盟在最新技术和现有技术方面实现创新,将创意转化为现实。我们非常自豪能够在推进超高速、超低时延、大容量5G网络的商业化进程中发挥积极作用,这种网络将使面向消费者和企业的应用获得突破性发展。”

当前和未来的无线系统中广泛使用了数字、射频、微波和毫米波技术,是德科技为这些技术提供了领先的仿真和测量解决方案。从最早的5G开发阶段开始,公司已帮助政府和学术界的研究人员以更高的精度、更强的信心探索开创性的概念。

是德科技副总裁兼互联网基础设施解决方案事业部总经理、PAWR理事会是德科技代表 Mark Pierpoint 博士表示:“对于研究人员来说,要想在5G研究中又快又好地取得突破,离不开创新的工具。这些工具使他们能够深入透彻地探索新的信号、场景和拓扑结构。5G和物联网仍在继续发展,我们的解决方案能使研究人员随着标准的演进而实施更深入的观察。”

是德科技的贡献还包括技术专家的参与,他们将会提供专业的技术咨询和测试帮助。是德科技以灵活的测试与测量硬件和功能强大的软件为基础,构建并提供了广泛的现有解决方案和下一代解决方案。而5G产品的设计、仿真与分析同样使用了这些硬件和软件。5G SystemVue 基带探索软件库是一个重要的实例,它支持研究人员探索 and 了解空中接口的物理层替代选择。参考解决方案使用是德科技硬件、软件和专业技术构建,能够满足特定应用的需求——例如毫米波频率的5G信道测量、5G波形生成和分析、Massive MIMO和波束赋形。高速数字设计与测试总体解决方案具有从仿真到一致性测试的全方位功能,使开发人员能够推动5G性能目标向前发展。

## 是德科技获得 Leonardo-Finmeccanica(莱昂纳多-芬梅卡尼卡)测试设备资产管理服务大单

是德科技的增值服务、高质量管理、技术创新以及合理的价格为此次成功奠定了基础

2016年8月11日,是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布与 Leonardo-Finmeccanica ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com))签订资产管理合同,为其分布在英国公司的所有测试设备提供相应服务。自6月1日起,是德科技负责为莱昂纳多提供测试设备托管服务(TEMS)。

TEMS项目启动于2015年,目的是为莱昂纳多在英国的测试设备设计并实施稳健的校准、维修和资产管理解决方案。同时,莱昂纳多还希望提高其测试设备的使用效率和可靠性。对服务、质量、创新和价格等多重标准开展了大规模评审之后,莱昂纳多与是德科技签订了为期3年的TEMS资产管理合同。

是德科技服务非常符合莱昂纳多的要求,可以提供全面的资产管理解决方案,帮助莱昂纳多有效、合理地使用其资产,同时降低其整体成本。是德科技最近还收购了英国 Electroservices,进一步丰富了旗下的创新服务解决方案,并由此成为一站式的服务提供商。

是德科技(英国)有限公司总经理 Chris Rennie 表示:“是德科技已与莱昂纳多合作多年,为他们提供测试系统和解决方案。我非常高兴莱昂纳多决定与是德科技签订本合同,构建双方更紧密的合作关系。我们期望帮助莱昂纳多管理和提高其在英国的各种测试资产的利用率。”

## NI 发布高精度的 PXI 源测量单元

全新的低电流 SMU 提供了高达 10 fA 的电流灵敏度

NI(美国国家仪器, National Instruments, 简称 NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出 NI PXIe-4135 源测量单元(SMU),其测量灵敏度达 10 fA,输出电压高达

200 V。工程师可以使用 NI PXIe-4135 SMU 来测量低电流信号,并利用 NI PXI SMU 的高通道密度、高速的测试吞吐率和灵活性来实现晶圆级参数测试、材料研究以及分析低电流传感器和集成电路的特性等各种应用。